

BƏRK CİSİMLƏRİN SƏTHİNDƏN İKİNCİ NÖV İON EMISSİYASININ KÜTLƏ SPEKTRLƏRİ HAQQINDA

HƏŞİMOV A.M., NURUBƏYLİ Z.K., NURIYEV K.Z¹, HƏSƏNOV M.Ə.

Azərbaycan MEA Fizika institutu
¹Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentlik.

Məqalədə qığılçım qaz boşalmasının təsiri nəticəsində bəzi metalların səthindən ikinci növ ion emissiyasının kütlə-spektrometrik tədqiqindən əldə edilmiş nəticələr verilmişdir. Kütləspektrinde hər bir elementə aid maksimuma uyğun cərəyanın hesablanmasından daha dəqiqlişli təklif edilmişdir.

Kütlə spektrometrik analiz fiziki metodlar içərisində ən həssas, ən dəqiqlişli üsul kimi maddələrin istər kimyəvi, istərsə də element tərkibinin öyrənilməsində həm də texnoloji proseslərin araşdırılmasında özünəməxsus yer tutur.

Bəzən bərk cisimlərin (kəmiyyət analizi zamanı) ikinci növ ionlarının kütlə spektri onun kimyəvi tərkibi ilə uyğunluq təşkil etmir. Müxtəlif müəlliflərin göldikləri nəticəyə görə buna səbəb bir tərəfdən müxtəlif elementlərin ikinci növ emissiyasının müxtəlifliyi o biri tərəfdən atomların ionlaşma xüsusiyyətidir. Bu uyğunsuzluğu nəzərə almaq üçün [1]-də həmin metodun təyin olunan elementə nəzərən nisbi həssaslığı adlanan anlayışdan istifadə olunması təklif olunur.

$$\gamma_{g.c}^x = \frac{I_x \cdot C_{g.c}}{C_x I_{g.c} \cdot F_{ch}}$$

Burada I_x , $I_{g.c}$ - tədqiq olunan elementin və daxili standartın ölçüle bilən analitik siqnalları (cərəyanları), C_x və $C_{g.c}$ həmin elementlərin uyğun konsentrasiyalıdır. $\gamma_{g.c}^x$ - daxili standartın nisbi həssaslıq və ya ionların nisbi çıxış əmsali, F_{ch} - ayıricı və qeyd edici qurğuların cihaz faktorudur.

Nisbi həssaslıq əmsalını standart nümunələrin təcrübə yolla aparılan analizin nəticələri əsasında təyin etmək olar. Bunun üçün tədqiq olunan nümunənin çox ehtimal olunan hər hansı bir (və ya bir neçə) elementinin ikinci növ emissiya qabiliyyətini təcrübə yolla araşdıraraq $I_{g.c}$ və $C_{g.c}$ kəmiyyətlərini təyin etmək kifayətdir. Çoxsaylı təcrübələr göstərir ki, bu empirik və ya yarımembrək yolla əldə olunmuş (1) ifadəsinin və bəzi nəzəri müddəələrin köməyi ilə ikinci növ ion emissiyası metoduna əsaslanan kütlə spektrometrik metodun sistematiq xətlərini orta hesabla 0,2-yə qədər azaltmaq olar [2].

İşdə məqsəd bəzi bərk cisimlərin strukturunu öyrənilməsində əldə olunmuş ikinci növ ion kütlə spektrlerinin dəqiqləşdirilməsi və bunun əsasında ikinci növ ion emissiyasının yaranma mexanizmini dəqiqləşdirməkdir.

İşdə təqdim edilmiş kütlə spektrleri kimyəvi tərkibi tədqiq olunan bərk maddələrin müxtəlif yollarla ionlaşdırılması (neytral zərrəciklərə bombardman, qığılçım boşalması, lazer şüast və s. təsirlər) zamanı əldə edilmiş nəticələrdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, müxtəlif təsirlər zamanı bərk cisim səthinin tərk edən atomların emissiya qanuna uyğunluğu katod tozlanması nəzəriyyəsi ilə izah olunmasına baxmayaraq ionlaşma mexanizmi dövrü metbuatda olduqca zəif və mübahisəli işıqlandırılır. Bu baxımdan təklif olunan mexanizmləri iki qrupa ayırmak olar.

1. Metal tərk edən atomun səth elektronları ilə mübadilə prosesində ionlaşması ehtimalının kvant-mexanikası əsasında hesablanan kvant-mexaniki modellər. Bu modellər əsasən təmiz metallara və sadə ərintilərə tətbiq olunduqda daha qənaətbəxş nəticələr verir.

2. Coxkomponentli nümunəni tərk edən nisbi çıxış əmsalı hesablamaga imkan verən empirik fenomenoloji modellər.

Bu cür modellərin tətbiqi çoxkomponentli sistemlər üçün nəzəri hesablamaların çətinliyi ilə izah olunur.

Təklif olunan işdə aparılan hesablamaların əsasını Kvant mexaniki model təşkil edir. Bu mexanizmə əsasən nümunə üzərinə düşən ilkin neytral atom dəstəsi (ion dəstəsi, boşalma impulsu və ya kvantı) onun səthindəki atomlarla qarşılıqlı təsirdə olaraq onlara bir sıra toqquşmalar zamanı öz enerjisini kristal qəfəsin atomları ilə bölüşür, onlara müyyən hərəkət momenti verir. Bu zaman həyecanlanmış atomların əldə etdikləri hərəkət momenti səthə yönələrsə, onlar səth ilə əlaqə qüvvəsinə üstün gələrək səthi tərk edə bilərlər. Hesablamalar göstərir ki, ilkin ionun (atomun) maddə ilə qarşılıqlı təsir və ikinci növ ionun maddəni tərk etmə müddəti 10^{-12} - 10^{-10} saniyədən çox olmur. Bu müddət həyecanlanmış atomun ionlaşması üçün kifayətdir. İlkin ionun (atomun) səth ilə qarşılıqlı təsir sahəsinin ölçüləri atomun ölçüləri tərtibində olduğundan çox ehtimal ki, bu lokal oblastın fiziki-kimyəvi xassələri maddənin həcm üzrə xassələrindən fərqlənsin. Ona görə də ionlaşmanın dərəcəsi maddənin atomlarının həyecənlanma ehtimalı və onun qarşılıqlı təsir müddətində relaksasiya ehtimalının hasilini ilə təyin olunur. Bu zaman həyecanlanmış atomların ionlaşmasını temin edən əsas amillər onun ionlaşma potensialı, atomun hərəkət sürəti, səhdən çıxış işi və ondakı elektronların strukturudur. Qeyd etmək lazımdır ki, axırıncı iki amil elektronların atomdan emissiya edərək ionları neytrallaşdırmaq ehtimalını təyin edir.

İkinci növ ion emissiyası prosesi olduqca mürəkkəb olduğundan, təcrubi nəticələrin araşdırılması zamanı işdə riyazi hesablamaların sadəliyi məqsədilə [1]-də təklif olunan kvazibərabər ehtimallı adlanan modeldən istifadə edilmişdir. Bu mexanizmin başqalarından fərqi ondadır ki, burada ilkin ionun bərk maddənin səthinin dağıtımı və maddənin atomlarının ionlaşma proseslərinin statistik çəkiləri eyni qəbul edilir. Bu cür aşağı tərtibli yaxınlaşmaya səbəb, adları çəkilən proseslərin mürəkkəbliyindən və tam öyrənilməməsindən irəli gelir.

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi təcrubi nəticələrin dəqiqliyini artırmaq məqsədi ilə ikinci növ ion emissiyası metodunun nisbi həssaslığını, başqa sözlə spektrə daxil olan elementlərin ionlaşmasının nisbiliyini nəzərə almaq lazımdır. Təcrübə göstərir ki, [3] nisbi həssaslığı xarakterizə edən ayrı-ayrı elementlərin ionlarının yaranma əmsalı $\gamma_{g.c}^x$ onların birqat ionlaşma potensialı φ_x^1 və həmin elementin D_x^0 xüsusi atomlaşma, başqa sözlə biratomlu buxar almaq üçün lazım olan enerjisindən kəsgin asılıdır.

$$\gamma_{g.c}^x = A \exp\left(-\frac{D_x^0 - D_{g.c}^0}{\kappa Ta}\right) x \exp\left(-\frac{\varphi_x^1 - \varphi_{g.c}^x}{\kappa Ta}\right) \text{ və ya}$$

$$\ln(\gamma_{g.c}^x) = a_1(D_x^0 - D_{g.c}^0) + a_2(\varphi_x^1 - \varphi_{g.c}^x)$$

Burada $a_1 = -\frac{1}{kTa}$, $a_2 = -\frac{1}{kTc}$ (Ta , Tc elementin atomlaşma və ionlaşma «temperaturları», k -Bolsman sabitidir.) Nəhayət ikinci növ ionların yaranma əmsalının dəqiqləşdirilmiş orta qiyməti aşağıdakı kimi olar.

$$\bar{\Delta\gamma}^x = \frac{\sum_{i=1}^n /(\gamma_i^x)_{eks} - (\gamma_i^x)_{nəz}}{n}$$

Beləliklə, təklif olunan üsulla aparılmış hesablamalar qığılçım boşalması üsulu ilə ikinci növ ionların kütlə spektrində hər bir elementin maksimumuna uyğun cərəyanın (və ya konsentrasiyasının) qiyməti dəqiqləşdirilmişdir. Bir neçə bərk cisim halında olan maddələrin kütlə spektrinə daxil olan elementlərin dəqiqləşdirilmiş müqayisəli qiymətləri aşağıdakı cədvəldə verilmişdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, cədvəldə verilmiş hər bir rəqəm onlarca spektrin riyazi işlənilməsindən əldə edilmişdir.

Cədvəl. Kütlə spektrinə daxil olan elementlərin dəqiqləşdirilmiş konsentrasiyası.

Atom çəkisi a k v	Element	Xüsusi atomlaşma enerjisi eV/at	Ionlaşma potensial V	Uyğun elementin konsentrasiyası, m ⁻³		$\bar{\Delta}\gamma^x$	Dəqiqləş mə, %
				Eksperim.	Nəzəri		
Paslanmayan poladın tərkibi							
51	Cr	2,56	6,764	$2,33 \cdot 10^{14}$	$1,2 \cdot 10^{14}$	$1,13 \cdot 10^{14}$	48,4
56	Fe	2,71	7,896	$8,82 \cdot 10^{14}$	$11,2 \cdot 10^{14}$	$-2,9 \cdot 10^{14}$	26,0
58	Ni	3,11	7,613	$0,1 \cdot 10^{14}$	$0,15 \cdot 10^{14}$	$-0,05 \cdot 10^{14}$	50,0
63	Cu	2,44	7,723	$0,8 \cdot 10^{14}$	$0,3 \cdot 10^{14}$	$0,5 \cdot 10^{14}$	62,5
107	Ag	2,97	7,574	$1,5 \cdot 10^{14}$	$2,1 \cdot 10^{14}$	$0,6 \cdot 10^{14}$	40,0
118	Sn	3,05	7,332	$2,7 \cdot 10^{14}$	$2,3 \cdot 10^{14}$	$0,4 \cdot 10^{14}$	14,4
121	S ₆	3,25	8,64	$0,3 \cdot 10^{14}$	$0,45 \cdot 10^{14}$	$-0,15 \cdot 10^{14}$	50,3
Mis ərintisinin tərkibi							
63	Cu	2,44	7,723	$7,8 \cdot 10^{13}$	$8,3 \cdot 10^{13}$	$-1,5 \cdot 10^{13}$	19,0
65	Zn	3,75	9,391	$1,1 \cdot 10^{13}$	$0,9 \cdot 10^{13}$	$0,2 \cdot 10^{13}$	145,0
75	As	4,05	9,85	$0,7 \cdot 10^{13}$	$0,5 \cdot 10^{13}$	$0,2 \cdot 10^{13}$	28,0
118	Sn	3,05	7,332	$2,0 \cdot 10^{13}$	$2,7 \cdot 10^{13}$	$-0,7 \cdot 10^{13}$	35,0
121	Sb	3,25	8,64	$1,5 \cdot 10^{13}$	$1,7 \cdot 10^{13}$	$0,2 \cdot 10^{13}$	13,3
207	Pb	3,35	7,415	$0,6 \cdot 10^{13}$	$0,33 \cdot 10^{13}$	$-0,233 \cdot 10^{13}$	38,8

[1] Рамендиk Г.I.; Манzon B.M.; Тюрин D.A. Журн.Аналит.химии 1989 т.44 №6 с.996

[2] Файнберг B.C.; Рамендиk Г.I. Журн. Аналит.химии 1991 том 46 №2 с.241.

[3] Барабашев C.B.; Тюрин D.A. Журн. Аналит.химии 1990 т.45 в.10 с.1922

МАСС-СПЕКТРЫ ВТОРИЧНЫХ ИОНОВ, ЭМИТИРУЕМЫХ С ПОВЕРХНОСТИ ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ

ГАШИМОВ А.М., НУРУБЕЙЛИ З.К., НУРИЕВ К.З., ГАСАНОВ М.А.

Проведен анализ масс-спектров вторичных ионов, эмитируемых с поверхности некоторых металлов. Предложен более точный метод расчета токов отдельных элементов в массовом спектре на основе квазистационарной модели выхода вторичных ионов.

**THE SECONDARY IONS OF MASS-SPECTERS EMITTED FROM
SURFACE OF SOLID SUBSTANCES**

HASHIMOV A.M., NURUBEYLI Z.K., NURIYEV K.Z., HASANOV M.A.

Analysis of the mass-specters' secondary ions, emitted from the several metals. More accurate method of current's estimate of separate elements in mass specters on the base of quasistationary model the secondary ions formation was suggested.